PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-139233

(43) Date of publication of application: 31.05.1996

(51)Int.Cl.

H01L 23/32

H01L 23/12 H01L 23/538 H01L 25/04

H01L 25/18

(21)Application number : 06-273191

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

08.11.1994

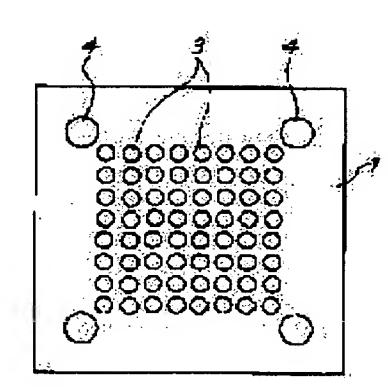
(72)Inventor: TSUNEKANE TOSHIAKI

(54) MODULE COMPONENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a module component which remarkably improves connection reliability when mounting on a printed circuit board.

CONSTITUTION: In the vicinity of the outermost circumference of connection lands 3 formed in lattice on the rear plane of a module substrate 1, reinforcement lands 4, which have a shape of disk, rectangle, hook, etc., and triple the area of one connection land or more, are provided. Thus, the reinforcement lands permit the module component to withstand the stress due to the difference between the thermal expansion coefficients of the printed circuit board and the module substrate, solder fatigue disconnection at the connection land is prevented and connection reliability is remarkably improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.03.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2859143

[Date of registration]

04.12.1998

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開平8-139233

技術表示當所

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.CL* 裁別記号 庁内整理番号 PI H01L 23/32 D 23/12 23/533

> H01L 23/12 K 23/52

未語求 語求項の数5 OL (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出顯番号 **特顯平6-273191** (71) 出頭人 000005821

松下電器産業株式会社 (22)出題日 平成6年(1994)11月8日 大阪府門真市大字門真1006番她

(72) 班明者 常包 數明

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 应業株式会社内

(74)代理人 弁理士 森本 義弘

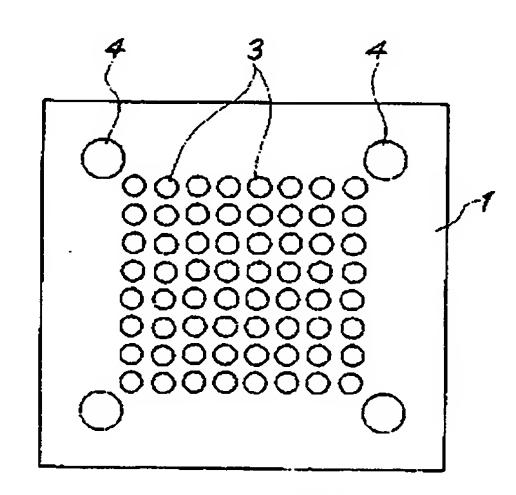
(54) 【発明の名称】 モジュール部品

(57)【要約】

【目的】 プリント回路基板への実装に接続信頼性を飛 躍的に高められるモジュール部品を提供することを目的 とする。

【構成】 モジュール基板 1 の裏面に格子状に形成され た接続ランド3の再外国近傍に円形、矩形、鈎形等の形 状をなし、かつ接続ランド1ケの面積の3倍以上の面積 を持つ結鎖ランド4を設けた構成とする。

【効果】 プリント回路基板とモジュール基板の熱膨脹 係数の差による応力を舗弦ランドが支え、接続ランド部 における半田の疲労断線を防止し接続信頼性を飛躍的に 向上させることができる。



- 1 モジュール基核
- 3 接続ランド 4 補強ランド

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 モジュール芸板の裏面に格子状に形成さ れた接続ランドの最外回近傍に接続ランド1ケの面積の 3倍以上の面積を持つ循弦ランドを設けたことを特徴と するモジュール部品。

1

【語求項2】 補強ランドを、格子状に配置された接続 ランドの最外層部のものに対し一部または全部が重なる ように配置したことを特徴とする請求項1記載のモジュ 一小部品。

【語求項3】 接続ランドの対角4隅の1~4ランドに 10 り外れたりする欠点がある。 信号回路を結線しないことを特徴とする請求項1記載の モジュール部品。

【謂求項4】 接続ランドの外園にモジュール部品単品 テスト用のテストランドを設けたことを特徴とする請求 項1記載のモジェール部品。

【語求項5】 接続ランドをモジュール基板の任意の位 置に片寄せて配置し、モジュール基板の荷重の偏りを、 **補強ランドで保持させたことを特徴とする請求項 1 記蔵** のモジュール部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は小型パソコンや、携帯電 話機。ビデオカメラ等、電子機器に使用されるモジュー ル部品に関する。

[0002]

【従来の技術】近年電子機器の小型化にともない。マル チチップモジュール等のモジュール部品が開発され、ブ リント基板へ実鉄使用されつつある。

【0003】以下に従来のモジュール部品について説明。 する。図10は従来のモジェール部品の側面図であり、 30 【0010】 図11はその下平面図である。図10および図11にお いて、1はモジュール基板であり、このモジュール基板。 1の裏面に接続ランド3が形成されている。図中の2は ●Cチップ等の表面実装部品である。

【①①①4】以上のように構成される従来のモジュール 部品の実装について、図12を用いて説明する。プリン ト回路基板5の接続ランド6上に半田クリーム8を印刷 し、その上にモジュール部品をマウントし、リフロー炉 に投入して半田グリーム8を溶融し、モジュール基板1 半田付けされる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 の構成では、モジュール基板1がセラミックプリント回 路墓板5がガラスエボキシ樹脂で、その熱膨脹係数が異 なる場合、温度変化により半田接続部に大きな広力が加 わり、接続信頼性が保証できなかったり、接続ピン数を 多くすることができないという問題点を有していた。

【りりり6】さらに詳しく説明すると、半田付けに際し プリント回路墓板5の接続ランド6上にクリーム半田8 55 【①012】

を印刷し、モジュール基板1の接続ランド3を対向させ てマウントし、リフロー炉にて加熱し半田付けを行う。 プリント回路基板5およびモジュール基板1に設けられ た接続ランド3、6はピッチが1から1.5mm.外径 がり、5からり、8mmを程度のため、プリント回路基 板5にクリーム半田8を印刷し、それに対向してマルチ チップモジュールをマウントした状態でのクリーム半田

2

8による粘着力は弱く、質量の大きいモジュール部品 は、半田付けが完了するまでに外力により位置がズレた

【0007】また半田リフローの過程においてプリント 回路基板5が熱で反るため、特にモジュールの4コーナ 付近の接続ランド3では半田付けが不完全になり、サー マルショップ等の信頼性試験を行うと最も先に断線が発 生する。

【0008】またモジュール基板1の村賃がセラミッ ク、プリント回路基板5の付置がガラスエボキシ樹脂等。 の組合せでも、熱膨脹率の差により特に接続ランドエリ アの4コーナ部で半田付け部の破壊断線等が起とる結果 20 となり、接続信頼性の面から接続ランドの配置エリアが 狭い範囲に制限され、多ピンの処理ができないなどの間 題点を有していた。

【①009】本発明は上記従来の問題点を解決するもの で、マウント後のモジュール部品のズレを防止し、また モジェール基板がセラミックプリント回路基板がガラス エポキシ樹脂のように熱膨脹率にある組合せでも高い信 類性が得られ、かつ接続ランドの配置エリアが広くと れ、多ピンの接続を可能とするモジュール部品を提供す ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明のモジュール部品は、モジュール基板の裏面に 格子状に形成された接続ランドの再外周近傍に、円形、 矩形、鈎形等の形状をなし、かつ接続ランド1ケの面積 の3倍以上の面積を持つ補強ランドを設けた構成とす る。

[0011]

【作用】本発明のモジュール部品のブリント回路基板へ の実装において、縞強ランドは、モジュール部品をクリ の接続ランド3がプリント回路基板5の接続ランド6に 40 ーム半田上へマウントしたとき粘着力が増大し、モジュ ール部品のズレの防止の役割を果たす。また半田リフロ 一時においては、径の小さな接続ランドでは生じにくい セルファライメント力を径の大きな補強ランドが増大す るため、モジュール部品が多少すれてマウントされても セルファライメントされ位置精度よく半田付けすること ができる。さらに半田リプロ一後においては、プリント 回路基板とモジュール基板の熱膨脹係敷の差による応力 を補強ランドが支え、接続ランド部における半田の疲労 断線を防止し接続信頼性を飛躍的に向上させる。

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401...

【実施例】以下本発明の一実施例におけるモジュール部 品について図面を参照しながら説明する。図1と図2は 本実施例のモジュール部品の側面図と下平面図である。 【0013】図1および図2において、1はモジュール 基板であり、このモジュール基板1の上面に1Cチップ 等表面突接部品2が突接されている。 このモジュール基

3

板1の裏面には半田付け可能な厚膜薬体やメッキ金属か ちなる接続ランド3および補強ランド4が形成されてい る.

モジュールをクリーム半田で接続するためのものであ り、直径0.5から0.8mmが、ピッチは0.5から 1. 5mm程度で格子状に配置されている。 消除ランド 4 は接続ランド3の配置エリアの対角の4 隅に設けら れ、外径は接続ランド1ケの面積の3倍以上の面積にな るように形成している。

【0015】以上のように構成された本真施例のモジュ ール部品について、その実験を図面を参照しながら説明 する。図3はブリント回路差板上へモジュール部品をク リーム半田で半田付けした状態を示す断面図である。 【①016】モジュール墓板1をプリント回懿墓板5に 突続するには、 まずプリント回路基板5の裏面に形成さ れた接続ランド6と補強ランド7の上にクリーム半田8 を印刷し、その後モジュール基板1の裏面に形成された 接続ランド3と補強ランド4をこれに対向させてマウン トする。循強ランド7および4が無いと、接続ランド6 および3は面積が小さいためクリーム半田8の钻着力は 弱く、半田付けが完了するまでにモジュール部品がズレ

板5の両方に広い面積を持つ循鎖ランド4名よび7を設 けることにより、クリーム半田8の鮎着力が大きく働 き、ズレや外れが防止できる。

たり外れたりする。

【①①18】また上記のようにマウントされたモジュー ル墓板1とプリント回路墓板5はリプロー炉に投入して 半田付けを行うが、リフロー炉内の高温によりプリント 回路基板5が反り、接続ランド6の外周部、特に対角の 4. 簡に位置するランド 6 は反り気味で不完全な半田付け になるが、消費ランド7を設けた場合はセルファライス ントの効果と揺れによる吸着力の働きにより完全な半田 40 付けが行われる。

【①①19】またモジュール基板1としてセラミックブ リント回路基板5としてガラスエポキシ樹脂等の組合せ が一般的であるが、この場合両者の熱膨脹率の差によ り、機器の使用中における温度変化により半田付け部が 繰り返し応力を受け、特に接続ランド3の対角の4コー ナ近傍の半田断線を起こしやすいが、 補強ランド4を設 けることにより、領強ランド4が応力を支えるため断線 に至るまでの寿命を飛躍的に延ばすことができる。また

場合に較べて接続ランド3の配置エリアを広く取ること ができ、多ピンの接続が可能となる。

【0020】また領強ランド4の形状については、図2 の円形の他に図4のような角形、図5のような鈎形、そ の他各種の形状が考えられる。配置の個数、箱強ランド の大きさはモジュールのサイズ、接続ランド3のエリア の広さから十分効果のある最適配置を選択する。 図6は 稿款ランド4の数をさらに増やした実施例を示す。

【0021】図7および図8は舗強ランド4を、格子状 【①①14】この接続ランド3はプリント回路基板1と 10 に配置された接続ランド3のエリア外ではなく、悔強ラ ンド4の一部または全部が接続ランド3のエリアと重な るように配置したことを特徴とするモジュール部品を表 したものである。

> 【0022】補強ランド4は円形、角形、その他各種考 えられるので、円と角を都合上、同一図に併記して表わ したものである。箱強ランド4と重なる接続パターンの 数は図7では4コーナ各1ケ、図8では4コーナ各4ケ の例を示したが、この他にも各種考えられる。こうする ことによりモジュールの外形サイズを大きくすることな 20 く簡強ランド4を設けることが可能である。

【0023】また図7、図8を用いて接続ランドの対角 4開の1~4ランドに信号回路を結除しないことを特徴 とするモジュール部品について説明する。半田付けの時 のプリント基板の反りにより、接続ランド3の対角の4 コーナ近傍の半田付けは他の部分にくらべ不完全である とともに、熱膨張率差による応力も最大になるため、信 類性上最も先に断線の発生する個所である。したがって **浦族ランド4で補強するとともに、この4コーナの各1** ランドから数ランドには信号回路を結算しない構造にす 【①①17】しかしモジェール基板1とプリント回路基 30 る。この配慮により故障発生にいたる接続信頼度は飛躍 的に向上する。

> 【0024】図9は本発明のモジュール部品の他の実施 例であるが、いままで述べてきた接続ランド3および箱 強ランド4の構成の他に、モジュールの検査用のテスト ランド9を設けたものである。この部分は接続信頼性か ちみると熱膨脹率の差による応力が眼界を越える部分の ため、半田付けは行わずモジュール単品でのテストラン ドとして用いる。テストランド9の設置によりモジュー ル芸板サイズが大きくなるので、苘重を支える補強ラン ド10を形成したものである。

【10025】なお接続ランド3の位置はモジュール基板 1の中央である必要はなく、プリント回路基板との関係 で端におくことも自由であり、基板の荷盒を支える精強 ランド10で強度を確保する。それによりモジュール基 板1の形状、寸法等の設計自由度が飛臨的に向上する。 [0026]

【発明の効果】以上の衰縮例の説明より明らかなよう に、本発明は面積の大きな補強ランドを接続ランドの外 風に設けることにより、モジュール部品マウント時の位 **箱強ランド4を設けることにより、捕強ランド4が無い 50 置ズレや外れの防止、半田リフロー時セルファライメン**

(4) **特期平8-139233**

ト性の向上、半田の疫労断線を防止し接続信頼性の飛躍 的向上、その他多くのメリットがあり、従来高価なボー ルグリッドアレーに頼っていたモジェール部品の実験 を、原価なランドグリッドアレーでの実用化を可能にす るものである。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施例のモジュール部品の正面図
- 【図2】同モジュール部品の下面図
- 【図3】同モジュール部品とプリント回路基板の接続状

盛を表す正面図

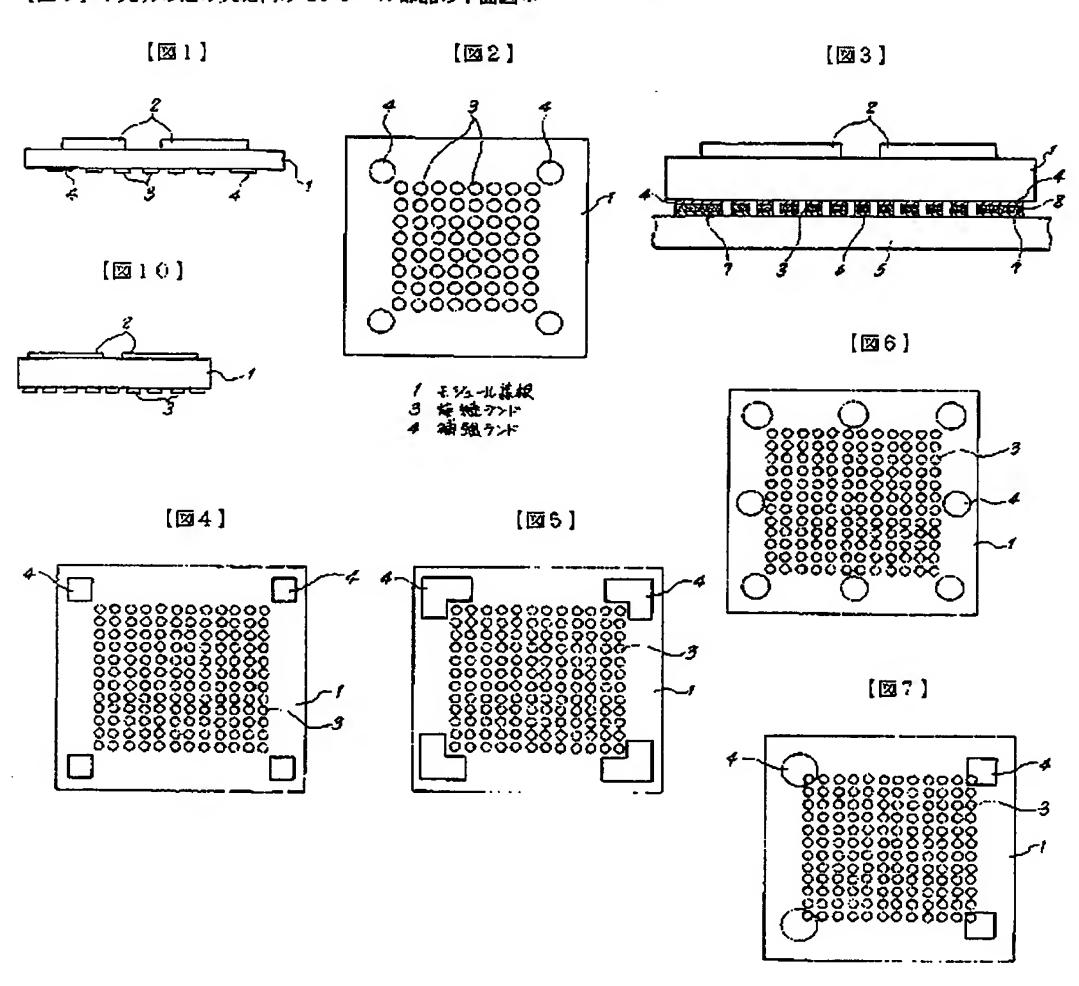
- 【図4】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図5】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図6】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図?】本発明の他の真臓側のモジュール部品の下面図
- 【図8】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図9】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図※

- *【図10】従来のモジュール部品の正面図
 - 【図11】従来のモジュール部品の下面図
 - 【図12】従来のモジュール部品とプリント回路墓板の

接続状態を表す正面図

【符号の説明】

- 1 モジュール基板
- 2 ICチップ等表面実装部品
- 3 接続ランド
- 4 🧃 領強ランド
- 19 5 プリント回路基板
 - 6 プリント回路基板の接続ランド
 - 7 プリント回路基板の補強ランド
 - 8 クリーム半田
 - 9 テストランド
 - 10 箱独ランド



(5) 特開平8-139233 [図8] [図9] [四11] 3 < 10. [212] AMERICAN RES フロントページの続き (51) Int.Cl.° 識別記号 FI 庁内整理各号 技術表示箇所 HO1L 25/04 25/18

HO1L 25/04

2

特開平8-139233

```
【公報程別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成11年(1999)6月18日
```

【公開香号】特開平8-139233 【公開日】平成8年(1996)5月31日 【年通号数】公開特許公報8-1393 【出願香号】特願平6-273191

【国際特許分類第6版】

H01L 23/32 23/12 23/538 25/04 25/18 [FI] H01L 23/32 23/12

【手統循正書】

【提出日】平成10年3月11日

【手続箱正1】

【補正対象書類名】明細書

23/52

25/04

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 モジュール部品

【特許請求の範囲】

【請求項1】 モジュール基板の裏面に格子状に形成された接続ランドの最外周近傍に接続ランド1ケの面積の3倍以上の面積を持つ補強ランドを設けたことを特徴とするモジュール部品。

【請求項2】 補強ランドを、格子状に配置された接続ランドの最外層部のものに対し一部または全部が重なるように配置したことを特徴とする請求項1記載のモジュール部品。

【請求項3】 接続ランドの対角4期の各1ランドから 数ランドに信号回路を結線しないことを特徴とする請求 項1記載のモジュール部品。

【請求項4】 接続ランドの外国にモジュール部品単品 テスト用のテストランドを設けたことを特徴とする請求 項1記載のモジュール部品。

【請求項5】 接続ランドをモジュール基板の任意の位置に片寄せて配置し、モジュール基板の荷倉の傷りを、 結発ランドで保持させたことを特徴とする請求項1記載 のモジュール部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は小型パソコンや、携帯電話機、ビデオカメラ等、電子機器に使用されるモジュール部品に関する。

[0002]

【従来の技術】近年電子機器の小型化にともない。マルチチップモジュール等のモジュール部品が開発され、プリント基板へ実装使用されつつある。

【0003】以下に従来のモジュール部品について説明する。図10は従来のモジュール部品の側面図であり、図11はその下平面図である。図10および図11において、1はモジュール基板であり、このモジュール基板1の裏面に接続ランド3が形成されている。図中の2は10チップ等の表面実装部品である。

【0004】以上のように構成される従来のモジュール 部品の実装について、図12を用いて説明する。プリント回路基板5の接続ランド6上に半田クリーム8を印刷 し、その上にモジュール部品をマウントし、リフロー炉 に投入して半田クリーム8を溶融し、モジュール芸板1 の接続ランド3がプリント回路基板5の接続ランド6に 半田付けされる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来の構成では、モジュール基板1がセラミック、プリント回路基板5がガラスエボキシ樹脂で、モの熱膨脹係数が異なる場合、温度変化により半田接続部に大きな応力が加わり、接続信頼性が保証できなかったり、接続ピン数を多くすることができないという問題点を有していた。 【0006】さらに詳しく説明すると、半田付けに際しプリント回路基板5の接続ランド6上にクリーム半田8

一浦 1-

特関平8-139233

を印刷し、モジュール基板1の接続ランド3を対向させてマウントし、リフロー炉にて加熱し半田付けを行う。プリント回路基板5およびモジュール基板1に設けられた接続ランド3、6はピッチが1から1、5mm、外径が0、5から0、8mmや程度のため、プリント回路基板5にクリーム半田8を印刷し、それに対向してマルチチップモジュールをマウントした状態でのクリーム半田8による粘着方は弱く、質量の大きいモジュール部品は、半田付けが完了するまでに外力により位置がズレたり外れたりする欠点がある。

【0007】また半田リプローの過程においてプリント 回路墓板5が熱で反るため、特にモジュールの<u>四勝</u>付近 の接続ランド3では半田付けが不完全になり、サーマル ショック等の信頼性試験を行うと最も先に断線が発生す る。

【0008】またモジュール基板1の特質がセラミック、ブリント回路基板5の特質がガラスエポキシ樹脂等の組合せでも、熱膨脹率の差により特に接続ランドエリアの4コーナ部で半田付け部の破壊断線等が起こる結果となり、接続信頼性の面から接続ランドの配置エリアが狭い節囲に制限され、多ピンの処理ができないなどの問題点を有していた。

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決するもので、マウント後のモジュール部品のズレを防止し、またモジュール基板がセラミック、ブリント回路基板がガラスエポキシ衛脂のように熱膨脹率に差がある組合せでも高い信頼性が得られ、かつ接続ランドの配置エリアが広くとれ、多ピンの接続を可能とするモジュール部品を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明のモジュール部品は、モジュール基板の裏面に格子状に形成された接続ランドの最外周近傍に、円形、矩形、鈎形等の形状をなし、かつ接続ランド1ケの面積の3倍以上の面積を持つ補強ランドを設けた構成とする。

[0011]

【作用】本発明のモジュール部品のブリント回路基板への実装において、循独ランドは、モジュール部品をクリーム半田上へマウントしたとき粘着力が増大し、モジュール部品のズレの防止の役割を果たす。また半田リフロー時においては、径の小さな接続ランドでは生じにくいセルファライメント力を径の大きな構強ランドが増大するため、モジュール部品が多少ずれてマウントされてもセルファライメントされ位置精度よく半田付けすることができる。さらに半田リフロー後においては、ブリント回路基板とモジュール基板の熱膨脹係敷の差による応力を補強ランドが支え、接続ランド部における半田の疲労断線を防止し接続信頼性を飛躍的に向上させる。

[0012]

【実能例】以下本発明の一実施例におけるモジュール部品について図面を参照しながら説明する。図1と図2は本実施例のモジュール部品の側面図と下平面図である。【0013】図1および図2において、1はモジュール基板であり、このモジュール基板1の上面に1Cチップ等表面実装部品2が実装されている。このモジュール基板1の裏面には半田付け可能な厚膜等体やメッキ金属からなる接続ランド3および補強ランド4が形成されている。

【0014】との接続ランド3はプリント回路差板1とモジュールをクリーム半田で接続するためのものであり、直径0、5から0、8mmが、ピッチは0、5から1、5mm程度で格子状に配置されている。循張ランド4は接続ランド3の配置エリアの対角の4隔に設けられ、外径は接続ランド1ケの面積の3倍以上の面積になるように形成している。

【0015】以上のように構成された本実施例のモジュール部品について、その実装を図面を参照しながら説明する。図3はプリント回路基板上へモジュール部品をクリーム半田で半田付けした状態を示す断面図である。【0016】モジュール基板1をプリント回路基板5の表面に形成された接続ランド6と指強ランド7の上にクリーム半田8を印刷し、その後モジュール基板1の裏面に形成された接続ランド3と補強ランド4をこれに対向させてマウントする。循強ランド7および4が無いと、接続ランド6および3は面積が小さいためクリーム半田8の钻着力は弱く、半田付けが完了するまでにモジュール部品がズレ

【0017】しかしモジュール基板1とプリント回路基板5の両方に広い面積を持つ循独ランド4名よび7を設けることにより、クリーム半田8の結着力が大きく働き、ズレや外れが防止できる。

たり外れたりする。

【① 0 1 8】また上記のようにマウントされたモジュール 基板 1 とプリント 回路 基板 5 はリフロー炉に投入して 半田付けを行うが、リフロー炉内の高温によりプリント 回路 基板 5 が反り、接続ランド 6 の外 圏部、特に対角の 4 開に位置するランド 6 は反り気味で不完全な半田付けになるが、結会ランド 7 を設けた場合はセルファライメントの効果と認れによる吸着力の働きにより完全な半田付けが行われる。

【①①19】またモジュール基板1としてセラミック、フリント回路基板5としてガラスエポキシ樹脂等の組合せが一般的であるが、この場合両者の熱膨股率の差により、機器の使用中における温度変化により半田付け部が繰り返し応力を受け、特に接続ランド3の対角の四限近傍の半田断線を起こしやすいが、循葉ランド4を設けることにより、補強ランド4を設けることにより、循独ランド4が無い場合ランド4を設けることにより、循独ランド4が無い場合

特閱平8-139233

に較べて接続ランド3の配置エリアを広く取ることができ、多ピンの接続が可能となる。

[0020]また結強ランド4の形状については、図2の円形の他に図4のような角形、図5のような約形、その他各種の形状が考えられる。配置の個数、結発ランドの大きさはモジュールのサイズ、接続ランド3のエリアの広さから十分効果のある最適配置を選択する。図6は結発ランド4の数をさらに増やした実施例を示す。

【0021】図7および図8は舗強ランド4を、格子状に配置された接続ランド3のエリア外ではなく、構強ランド4の一部または全部が接続ランド3のエリアと重なるように配置したことを特徴とするモジュール部品を表したものである。

【0022】補強ランド4は円形、角形、その他各種考えられるので、円と角を都合上、同一図に併記して衰わしたものである。結強ランド4と重なる接続パターンの数は図7では四隅各1ケ、図8では四隅各4ケの例を示したが、この他にも各種考えられる。こうすることによりモジュールの外形サイズを大きくすることなく補強ランド4を設けることが可能である。

【0023】また図7、図8を用いて接続ランドの対角 4 開のランド4に信号回路を結譲しないことを特徴とするモジュール部島について説明する。半田付けの時のブリント基板の反りにより、接続ランド3の対角の四隅近傍の半田付けは他の部分にくらべ不完全であるとともに、熱膨張率差による応力も最大になるため、信頼性上最も先に断線の発生する個所である。したがって補強ランド4で結強するとともに、この四隅の各1ランドから数ランドには信号回路を結線しない構造にする。この配慮により故障発生にいたる接続信頼度は飛躍的に向上する。

【0024】図9は本発明のモジュール部品の他の実施例であるが、いままで述べてきた接続ランド3および箱強ランド4の構成の他に、モジュールの検査用のテストランド9を設けたものである。この部分は接続信頼性からみると熱膨脹率の差による応力が限界を越える部分のため、半日付けは行わずモジュール単品でのテストランドとして用いる。テストランド9の設置によりモジュール差板サイズが大きくなるので、荷重を支える補強ランド10を形成したものである。

【0025】なお接続ランド3の位置はモジュール基板

1の中央である必要はなく、プリント回路基板との関係で端におくことも自由であり、基板の荷章を支える結強ランド10で強度を確保する。それによりモジュール基板1の形状、寸法等の設計自由度が飛躍的に向上する。【0026】

【発明の効果】以上の実施例の説明より明らかなように、本発明は面積の大きな構設ランドを接続ランドの外国に設けることにより、モジュール部品マウント時の位置ズレや外れの防止、半田リフロー時をルフアライメント性の向上、半田の疲労断線を防止し接続信頼性の飛躍的向上、その他多くのメリットがあり、従来高価なボールグリッドアレーに頼っていたモジュール部品の実装を、原価なランドグリッドアレーでの実用化を可能にするものである。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施例のモジュール部品の正面図
- 【図2】同モジュール部品の下面図
- 【図3】同モジュール部品とプリント回路基板の接続状態を表す正面図
- 【図4】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図5】本発明の他の箕槌側のモジュール部品の下面図
- 【図6】本発明の他の真態例のモジェール部品の下面図
- 【図7】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図8】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図9】本発明の他の実施例のモジュール部品の下面図
- 【図10】従来のモジュール部品の正面図
- 【図11】従来のモジュール部品の下面図
- 【図12】従来のモジュール部品とブリント回路基板の接続状態を衰す正面図

【符号の説明】

- 1 モジュール基板
- 2 ICチップ等表面実装部品
- 3 接続ランド
- 4. 循独ランド
- 5 プリント回路基板
- 6 プリント回路基板の接続ランド
- 7 プリント回路基板の補強ランド
- 8 クリーム半田
- 9 テストランド
- 10 縞礁ランド

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☑ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.